


タイトル 電子部品(電極)の導通不良の原因を調べました

<p>事例</p> <p>試験内容と結果</p>	<p>電子部品電極の導通不良の原因調査</p> <p>電子部品の銅電極の上にめっきを行ったところ、めっき後に抵抗値が上昇するロットが発生。OKロットとNGロットについて、めっき前の銅電極部分を観察すると、わずかに色が異なるように見えました。そこで、X線光電子分光分析装置により表面分析を行ったところ、NGロットではCuOによるピークが観察され、酸化膜が形成されていることが分かりました。この酸化膜によって、めっき後の抵抗値が上昇したものと推測されました。</p> 
<p>使用した装置</p>	<p>マイクロX線光電子分光装置(μ-XPS) (Quantum 2000: アルバックファイ製)</p> 
<p>手数料 (平成21年)</p>	<p>・エックス線光電子分光分析 25,160円/1試料</p>
<p>担当部署</p>	<p>機械電子研究所 電子技術課 Tel. 076-433-5466</p>